



(19) 中華民國智慧財產局

(12) 設計說明書公告本

(11) 證書號數：TW D239166 S

(45) 公告日：中華民國 114 (2025) 年 07 月 01 日

(21) 申請案號：113304790

(22) 申請日：中華民國 113 (2024) 年 09 月 18 日

(51) LOC.(13)Cl.：13-99

(71) 申請人：南韓商李諾工業股份有限公司 (南韓) LEENO INDUSTRIAL INC. (KR)
南韓(72) 設計人：李彩允 LEE, CHAEYOON (KR)；白承夏 BAEK, SEUNGHA (KR)；朴東鏞 PARK,
DONGHOON (KR)；孫振植 SON, JINSIK (KR)

(74) 代理人：卓俊傑；鮑亞嵐；卓孟儀

(56) 參考文獻：

TW I264540

TW I619948

TW M457183

TW M638620

CN 203732577

審查人員：徐銘鋒

圖式數：8 共 8 頁

(54) 名稱

測試探頭筒

代表圖：



【立體圖 (代表圖)】



D239166

【設計說明書】

【中文設計名稱】 測試探頭筒

【英文設計名稱】 BARREL FOR TEST PROBE

【物品用途】

【0001】 本設計物品是一種用於測量電氣特性（例如晶圓上佈線的連續性或電阻）的測試探頭的測試探頭筒。

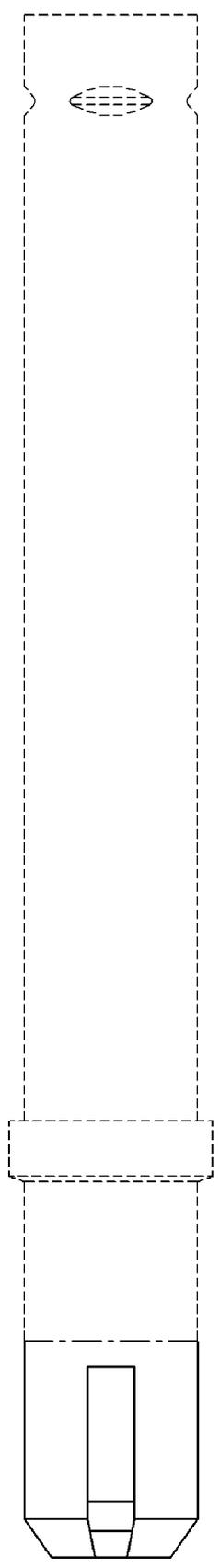
【設計說明】

【0002】 圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。圖式中一點鏈線所圍繞者，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分。使用狀態參考圖表示測試探頭筒在使用時與其他配件的組裝關係的爆炸圖。

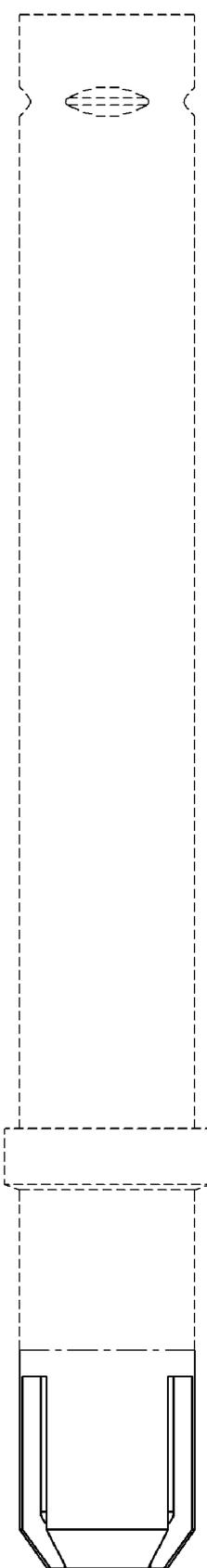
【設計圖式】
(指定代表圖)



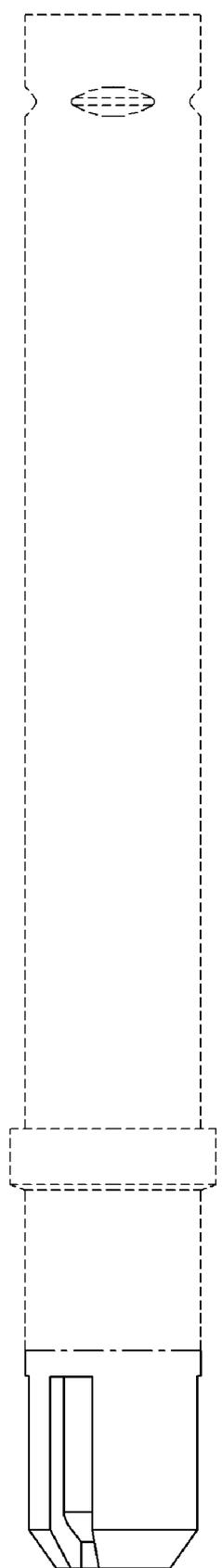
【立體圖 (代表圖)】



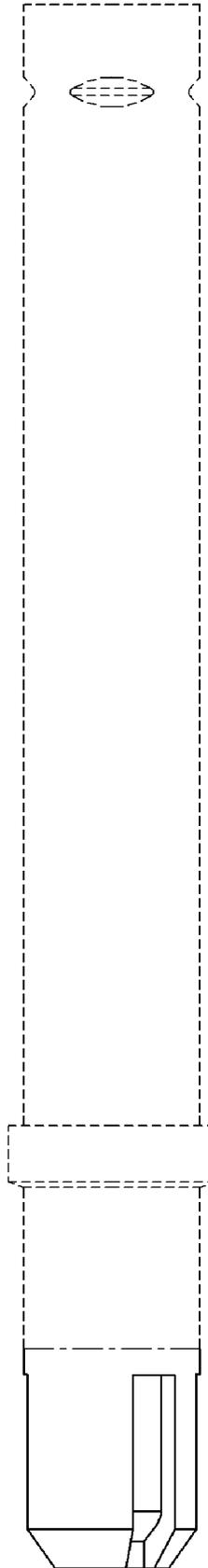
【前視圖】



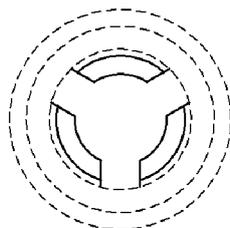
【後視圖】



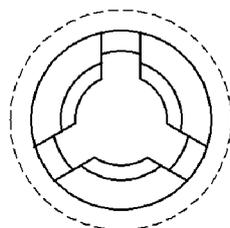
【左側視圖】



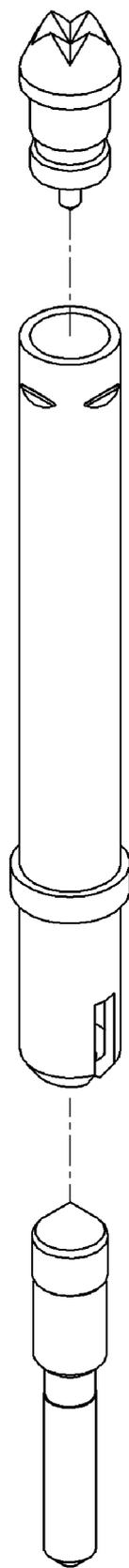
【右側視圖】



【俯視圖】



【仰視圖】



【使用狀態參考圖】